

- [2] D r o u h i n H.J., H e r m a n n C., L a m -
p e l G. - Festkorperprobleme, 1985, v. 25, p.255.
- [3] H o u d r é R., H e r m a n n C., L a m -
p e l G., F r i j l i n k P.M. - Surface Science, 1986, v. 168, p. 538.
- [4] S p i c e r W.E., L i n d a u I., S k e a t c h P.,
S u C.Y. - Chys P.; Phys. Rev. Lett., 1980, v. 44,
p. 420.
- [5] M a k r a m-E b e i d S., M a r t i n G.M.
Deep Centers in Semiconductors, Gordon Breach,
New York, 1986, p. 399.
- [6] V o n B a r d e l e b e n H.J., B o u r -
g o i n J.C. - J. Appl. Phys., 1985, v. 58, p. 1041.
- [7] B a g r a e v N.T., M a s h k o v V.A. -
Materials Science Forum, 1986, v. 10-12, p. 435.

Поступило в Редакцию
11 ноября 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 4

26 февраля 1988 г.

НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ И СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТИ

О.А. А к ц и п е т р о в, С.И. В а с и л ь е в,
В.И. Панов

В работе проведена калибровка чувствительности нелинейно-оптического метода контроля шероховатости поверхности, предложенного в работах [1, 2] прямыми топографическими исследованиями с помощью сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) высокого разрешения [3].

1. Нелинейно-оптический метод контроля шероховатости поверхности металлов и полупроводников основан на изучении отличительных особенностей поляризации и диаграммы направленности излучения отраженной второй гармоники (ВГ) при ее генерации на гладкой и шероховатой поверхности твердого тела.

На гладкой поверхности изотропных сред процесс генерации отраженной ВГ подчиняется поляризационным правилам отбора, называемым s,s - и ρ,s - запретами [2]. Согласно этим правилам отбора, s - поляризованный вторая гармоника отсутствует и для s - и для ρ - поляризованного излучения накачки. Диаграмма направленности излучения отраженной ВГ для разрешенной ρ,ρ -геометрии на гладкой поверхности имеет зеркальный характер [4].

На шероховатой поверхности уже нельзя говорить о s,s - или ρ,s - геометрии нелинейного взаимодействия в чистом виде.

Поэтому на такой поверхности генерируется отраженная ВГ с запрещенной δ - поляризацией, интенсивность которой $I_{2\omega}^{P,S}$ (или $I_{2\omega}^{A,S}$) может служить мерой шероховатости. Диаграмма направленности излучения запрещенной ВГ диффузна [5]. Высокая чувствительность нарушения поляризационных запретов к шероховатости была продемонстрирована в работе [2], в которой запрещенная ВГ уверенно регистрировалась при суммарном объеме металла, заключенного в шероховатости, меньшем одного моноатомного слоя. Прямые микроскопические исследования столь малой неоднородности поверхности монолитных образцов традиционными методами провести невозможно. Только тунNELьная микроскопия позволяет исследовать топографию поверхности достаточно толстых слоев металла с необходимым в данном случае разрешением.

2. Для определения предельной чувствительности нелинейно-оптического метода исследования шероховатости были приготовлены поликристаллические образцы золота и серебра с максимально достижимой в наших условиях гладкостью поверхности. Пленки золота с толщиной $\sim 600 \text{ \AA}$ наносились вакуумным термическим напылением на специальную слоистую структуру, представляющую собой химически полированную кварцевую пластину с последовательно напыленными слоями хрома и палладия с толщинами $\sim 700 \text{ \AA}$ каждый.

Серебряные поликристаллические пленки приготавлялись термическим напылением серебра в высоком вакууме (остаточное давление $\sim 10^{-9}$ торр) на поверхность золотой пленки, охлажденной до температуры $T \sim 77 \text{ K}$. Перед нелинейно-оптическими измерениями образцы серебряных пленок отжигались в высоком вакууме при комнатной температуре.

Поверхность серебряного электрода, на которой исследовалась генерация ВГ при нанесении шероховатости с эффективным объемом металла в несколько моноатомных слоев, приготавливалась путем механической полировки поликристаллического серебра с помощью окиси алюминия с размером зерен 0.05 мкм . Для прецизионного нанесения шероховатости проводилось анодное травление поверхности в электрохимической ячейке с водным раствором хлористого калия при плотности заряда $q \sim 2-3 \text{ мКл/см}^2$, что соответствует схеме нанесенной шероховатости $\sim 5-8$ монослоев серебра.

3. Нелинейно-оптические исследования шероховатости проводились при комнатной температуре и атмосферных условиях по методике, описанной в работе [2]. Измерялось отношение интенсивности запрещенной P,S - гармоники к интенсивности разрешенной P,P - гармоники $\delta = I_{2\omega}^{P,S}/I_{2\omega}^{P,P}$. Значения нелинейно-оптического параметра шероховатости δ , полученные для различных типов шероховатости, сведены в таблицу.

Геометрические параметры шероховатости измерялись с помощью СТМ, имеющего разрешение по нормали $\delta z \approx 0.1 \text{ \AA}$ и в плоскости поверхности $\delta l \sim 2 \text{ \AA}$ [3]. В таблице приведены полученные значения средней высоты неоднородности (либо глубины впадин) Az и продольной корреляционной длины Ab .

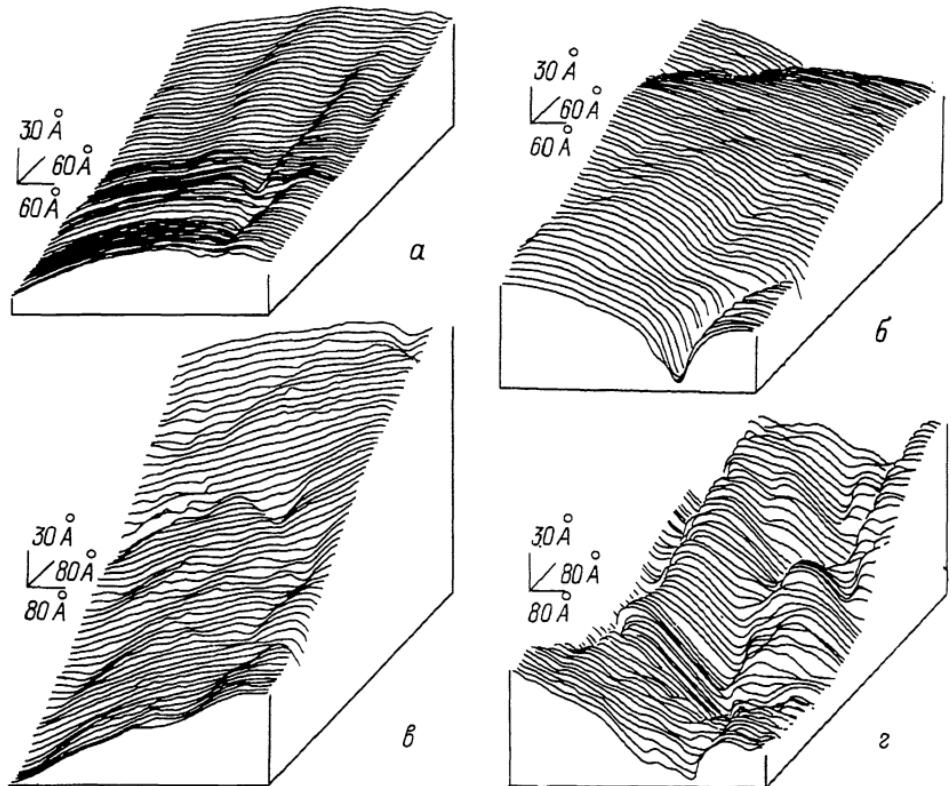
Т а б л и ц а

Тип поверхности	σ	Параметры неоднородности	
		$\Delta z (\text{\AA})$	$\lambda z (\text{\AA})$
Напыленная пленка золота	$(5 \pm 2) \cdot 10^{-3}$	$\gtrsim 10$	100 500
Напыленная пленка серебра	$(1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-2}$	$\gtrsim 50$	500
Полированный серебряный электрод	$(1 \pm 0.3) \cdot 10^{-2}$	20-30	200
Серебряный электрод после анодного травления	$(1 \pm 0.2) \cdot 10^{-1}$	50-100	100 500

4: Наиболее гладкую поверхность из исследованных нами образцов имеет пленка золота. Характерный вид поверхности такой пленки с плавной волнообразной шероховатостью представлен на рис. 1, а. Средняя высота неоднородности составляет $\Delta z \gtrsim 10 \text{ \AA}$. Корреляционная длина неоднородности сильно различается в двух перпендикулярных направлениях в плоскости пленки $\lambda z_1 \sim 100 \text{ \AA}$, $\lambda z_2 \sim 500 \text{ \AA}$. Нелинейно-оптический параметр для поверхности с такой шероховатостью имеет величину $\sigma \sim (5 \pm 2) \cdot 10^{-3}$. Малое значение σ в данном случае определяется не столько малой величиной Δz , сколько связано с соотношением $\lambda z_{1,2} \gg \Delta z$. На такой плавной шероховатости не происходит возбуждение локализованных поверхностных плазмонов (ПП) и мал коэффициент поверхностного усиления для отраженной ВГ, который определяется в этом случае возбуждением поверхностных плазмон-поляритонов. Поскольку запрещенная P_s -гармоника непосредственно связана с поверхностным усилением [5], ее интенсивность для „гладкой” пленки золота мала $I_{2\omega}^{P_s} \ll I_{2\omega}^{AP}$.

Поверхность отожженных пленок серебра, напыленных на холодную подложку, имеет другой тип шероховатости, представляющий собой сравнительно большие гладкие участки, разделенные узкими щелями – границами микрокристаллитов – рис. 1, б. Глубина провалов для такой пленки $\Delta z \gtrsim 50 \text{ \AA}$, корреляционная длина $\lambda z \sim 500 \text{ \AA}$. Хотя и в этом случае выполняется соотношение $\lambda z \gg \Delta z$, параметр $\sigma \sim (1.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-2}$ существенно больше. Увеличение σ , по-видимому, вызвано остаточным поверхностным усилением, связанным с локализацией плазмонов на межкристаллитных провалах (с) – эффектом щелей [6].

Поверхность серебряного электрода после механической полировки имеет существенно меньшую корреляционную длину шероховатости $\lambda z \sim 200 \text{ \AA}$ при средней высоте неоднородности $\Delta z \sim 20-30 \text{ \AA}$ (рис. 1, в). Для такой поверхности соотношение между λz и Δz



Топография поверхности: напыленной пленки золота (а); отожженной пленки серебра, напыленной на холодную золотую подложку (б); полированного серебряного электрода до анодного травления (в), после анодного травления зарядом, эквивалентным 5–8 моноатомным слоям серебра (г).

становится менее жестким, что приводит к более эффективному, чем в случае пленки золота, возбуждению локализованных ПП. Связанное с этим поверхностное усиление определяет величину $\sigma \sim (1 \pm 0.3) \cdot 10^{-2}$. После электрохимического травления с плотностью заряда $q \sim 2\text{--}3 \text{ мКл/см}^2$ шероховатость поверхности принимает гранулярный характер (рис. 1, г). Возбуждаемые в гранулах излучением накачки локализованные ПП приводят к интенсивной генерации гигантской ВГ и, следовательно, к большим значениям нелинейно-оптического параметра $\sigma \sim (1 \pm 0.2) \cdot 10^{-1}$.

Таким образом, прямые микроскопические исследования, выполненные с помощью СТМ высокого разрешения, показывают высокую предельную чувствительность нелинейно-оптического метода дистанционного контроля, позволяющего регистрировать шероховатость с размерами $\gtrsim 10 \text{ \AA}$.

В заключение авторы благодарят Л.В. Келдыша за организацию работы и полезные обсуждения, Е.Д. Мишину и В.Б. Леонова за помощь в проведении измерений.

Л и т е р а т у р а

- [1] А к ц и п е т р о в О.А., Б а р а н о в а И.М., И л ь -
и н с к и й Ю.А. – ЖЭТФ, 1986, т. 91, в. 1 (7), с. 287.
- [2] А к ц и п е т р о в О.А., К у л ю к Л.Л., П е т у х о в А.В.,
С т р у м б а н Э.Е., Цыцану В.И. – Письма в ЖТФ,
1986, т. 12, в. 22, с. 1345.
- [3] В а с и л ь е в С.И., Л е о н о в В.Б., П а н о в В.И. –
Письма в ЖТФ, 1987, т. 13, в. 15, с. 937.
- [4] Б л о м б е р г е н Н. Нелинейная оптика, М.: Наука, 1964.
- [5] А к ц и п е т р о в О.А., П е т у х о в А.В., П е т у х о -
в а А.Л. – Оптика и спектроскопия, 1987, т. 63, в. 2, с. 437.
- [6] А к ц и п е т р о в О.А. и др. – Письма в ЖЭТФ, 1986,
т. 44, в. 8, с. 371.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
19 ноября 1987 г.